DIN EN ISO 3882:2003-10 (D)

Metallische und andere anorganische Überzüge - Übersicht über Verfahren zur Schichtdickenmessung (ISO 3882:2003); Deutsche Fassung EN ISO 3882:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 5

4 Zerstörungsfreie Verfahren 5
4.1 Lichtschnittverfahren, ISO 2128 5
4.2 Magnetische Verfahren, ISO 2178 und ISO 2361 5
4.3 Wirbelstromverfahren, ISO 2360 6
4.4 Röntgenspektrometrische Verfahren, ISO 3497 6
4.5 Betarückstreuverfahren, ISO 3543 7

5 Zerstörende Verfahren 7
5.1 Mikroskopisches (optisches) Verfahren, ISO 1463 7
5.2 Mehrstrahlinterferometrisches Verfahren nach Fizeau, ISO 3868 7
5.3 Profilometrisches Verfahren (Tasterverfahren), ISO 4518 7
5.4 Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop, ISO 9220 8
5.5 Auflöseverfahren 8
5.5.1 Coulometrisches Verfahren, ISO 2177 8
5.5.2 Gravimetrisches Verfahren (Auflösen und Wägen), ISO 10111 8
5.5.3 Gravimetrisches (analytisches) Verfahren, ISO 10111 8

Literaturhinweise 12

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen 13